

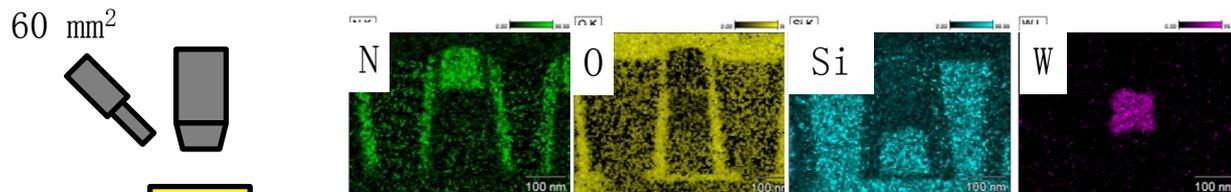
SM JSM-7610F 高分辨率分析

JSM-7610F低加速电压下的高分辨率元素分析

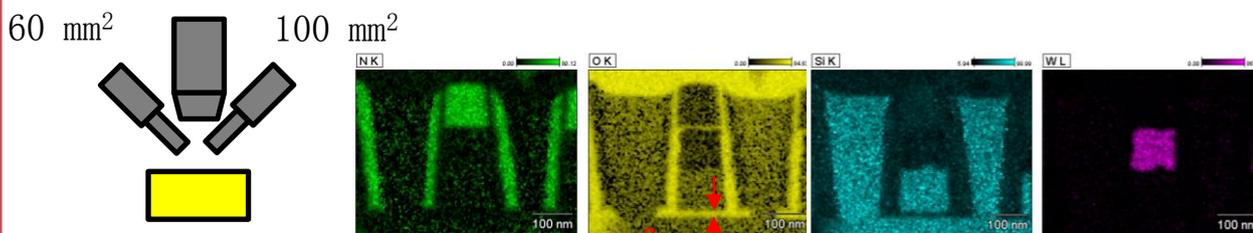
JSM-7610F配备了肖特基热场发射电子枪，因此可以获得很大的探针电流。下面是对各种样品的快速元素分析结果。

STEM EDS分析DRAM

重量 % 加速电压: 30 kV 探针电流: 2 nA 时间: 10 分钟



利用60mm² EDS检测器的结果。



利用60mm² 和100mm²EDS检测器的结果。

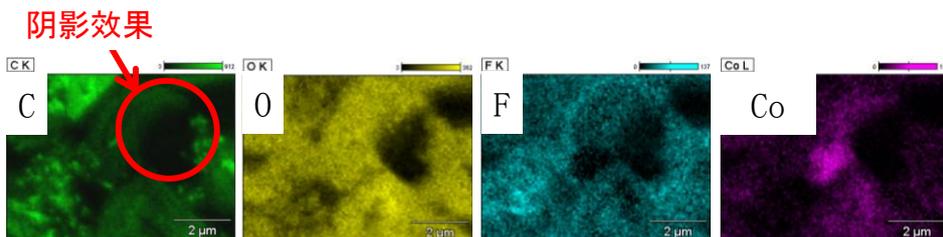
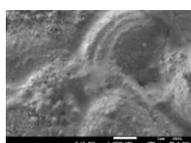
JSM-7610F使用2个EDS检测器，可以分析6 nm的线宽。

SEM/EDS分析锂离子电容器(LiCoO₂)的阴极材料

净计数

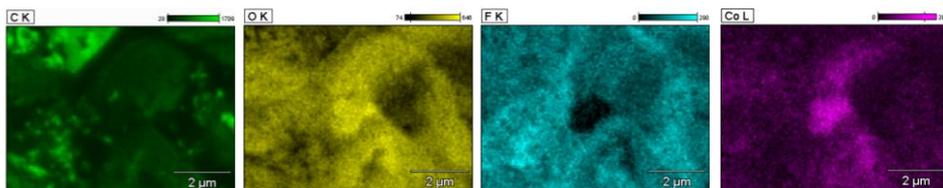
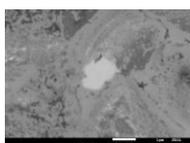
加速电压: 1 kV 探针电流: 15 nA 时间: 10 分钟

SE像



利用100mm² EDS检测器的结果

BE像



利用60 mm² 和100 mm²EDS检测器的结果

利用两个EDS检测器获得的图像无阴影效应。

此外，利用7610F的大探针电流，即使在低加速电压下也能在较短时间内完成分析。